

外側マイクロメータの JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

外側マイクロメータ



画像提供：(株)ミットヨ

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正場所	校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)	
		恒久的施設校正	巡回校正 (出張校正)
恒久的施設校正 及び 巡回校正 (出張校正)	25 mm 以下	2 μm	3 μm
	25 mm 超過 50 mm 以下	3 μm	4 μm
	50 mm 超過 75 mm 以下	3 μm	6 μm
	75 mm 超過 100 mm 以下	5 μm	7 μm

端子構造によって、校正できない場合があります。
巡回校正（出張校正）もご対応しております。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法

